

## II. ETUDE DE FIABILITÉ

### ❖ Hypothèses:

- a. On s'intéresse à un bien choisi au hasard dans une population constituée des biens du même type;
- b. Soit  $t_0 = 0$  : L'instant où le bien choisi est mis en marche, soit pour la 1<sup>ère</sup> fois (mise en service), soit après une réparation (remise en état de fonctionnement).
- c. Soit  $T$  une **variable aléatoire** qui à tout bien choisi au hasard dans la population, associe son **TBF** (**T**emps de **B**on **F**onctionnement ; *en anglais* **T**ime **B**etween **F**ailure) ou sa durée de vie avant une défaillance. Tel que :
  - $T$  : Mesure l'instant où apparaît une défaillance à partir de l'instant  $t_0 = 0$
  - $T$  : variable aléatoire continue qui prend les valeurs  $[0, +\infty]$  ;
  - $T$  : Possède une densité de probabilité.



### ❖ Fonction de répartition de la variable $T$

#### a. En terme de défaillance

En terme de défaillance, la fonction de répartition de la variable  $T$ , est la probabilité qu'un bien prélevé au hasard dans la population considérée **ait** une défaillance avant l'instant  $t$ .

On définit mathématiquement la fonction de défaillance par le nombre  $F(t)$  « en anglais **Failure** », pour  $t \geq 0$

$$F(t) = P(T \leq t) = \int_0^t f(t) dt$$

$$F'(t) = f(t) \quad 0 \leq F(t) \leq 1$$

- $F(t)$  : Fonction de défaillance du système
- $f(t)$  : la densité de défaillance ou bien la densité de probabilité de la variable  $T$

#### b. En terme de fiabilité

En terme de fiabilité, la fonction de répartition de la variable  $T$ , est la probabilité qu'un bien prélevé au hasard dans la population considérée **n'ait pas** de défaillance avant l'instant  $t$ .

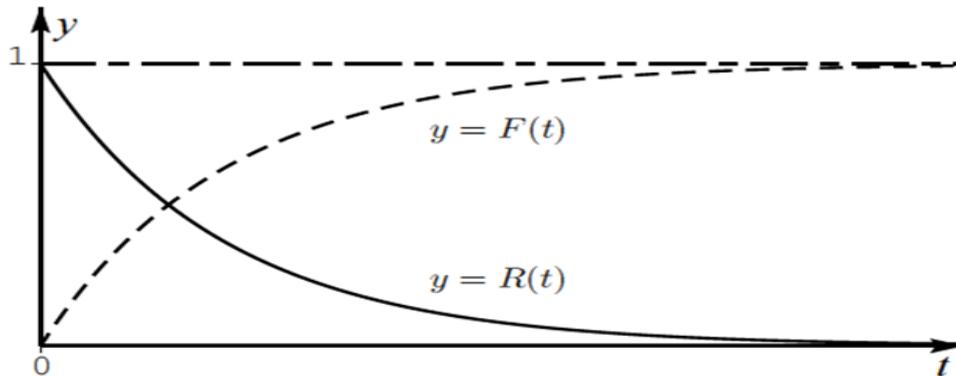
On définit mathématiquement la fonction de fiabilité par le nombre  $R(t)$  « en anglais **Reliability** » associée à celle de la défaillance, tel que pour tout  $t \geq 0$  :

$$R(t) = P(T \geq t)$$

- Sachant que  $T \geq t$  est l'événement contraire de  $T \leq t$ , on peut écrire:  $P(T \geq t) = 1 - P(T \leq t)$

- Puisque  $P(T \leq t) = F(t)$  et  $P(T \geq t) = R(t)$ , alors on a:

$$R(t) = 1 - F(t)$$



❖ **Taux de défaillance instantané  $\lambda(t)$**

L'écriture mathématique du taux de défaillance à l'instant  $t$  noté  $\lambda(t)$  est la suivante :

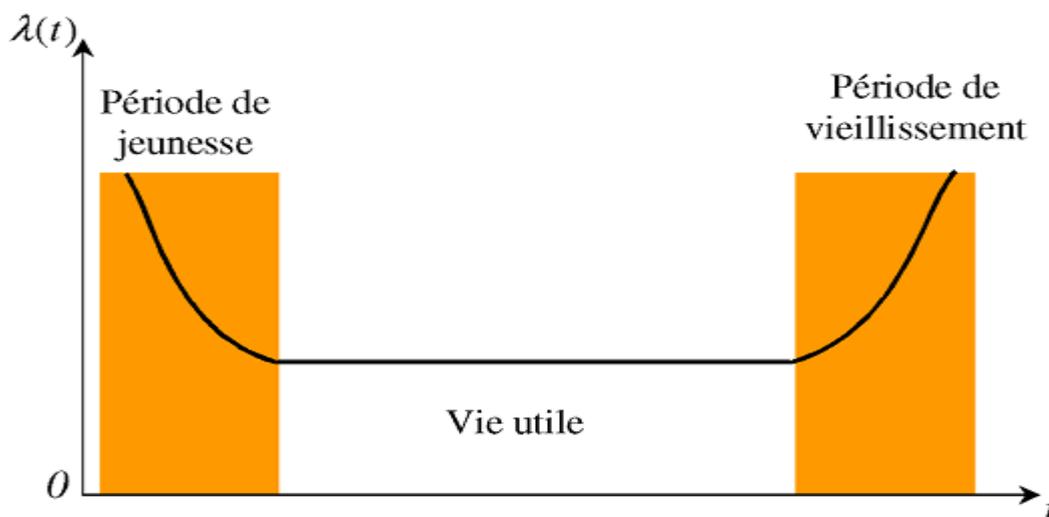
$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \left( \frac{1}{\Delta t} \cdot \frac{R(t) - R(t + \Delta t)}{R(t)} \right)$$

physiquement le terme  $\lambda(t)$ , mesure la probabilité qu'une défaillance d'un dispositif se produise dans l'intervalle de temps  $[t, t + \Delta t]$  sachant que ce dispositif a bien fonctionné jusqu'à l'instant  $t$ .

Le taux de défaillance d'un dispositif à l'instant  $t$  est donc défini par :

$$\lambda(t) = - \frac{dR(t)}{dt} \cdot \frac{1}{R(t)} = \frac{dF(t)}{dt} \cdot \frac{1}{R(t)} = \frac{f(t)}{R(t)}$$

Le comportement temporel du taux de défaillance est représenté par la courbe en baignoire,



Cette courbe comporte trois phases :

- **Zone 1** : Période de jeunesse (rodage) ou bien *période de défaillance précoce*
  - Cette zone représente la période de début de fonctionnement,

- Le taux de défaillance décroît avec le temps, car les défaillances précoces sont dues à des *défauts de fabrication ou de conception*.
- **Zone 2** : Période de maturité (pleine activité) ou bien *période de défaillance à taux constant*.
  - Cette zone représente la période de maturité, ou vie utile
  - Le taux de défaillance reste à peu près constant ; pendant cette période, les défaillances qui apparaissent sont dues au *hasard*.
- **Zone 3** : Période de vieillesse ou d'usure ou bien *période de défaillance*.
  - Cette zone représente la période d'usure.
  - Le taux de défaillance croît avec le temps, car les défaillances sont dues à *l'âge ou à l'usure croissante du bien* du fait de la dégradation du matériel.

❖ **Temps moyen de bon fonctionnement MTBF**

Pour les biens réparables on retient comme indicateur de fiabilité, la moyenne des temps de bon fonctionnement satisfaisant entre deux défaillances du bien.

On le désigne par "MTBF" (**M**ean **T**ime **B**etween **F**ailure = **M**oyenne des **T**emps de **B**on **F**onctionnement).

On distingue deux aspects pour le calcul de la MTBF :

a. **aspect probabiliste** : La MTBF comme espérance mathématique de la variable aléatoire T.

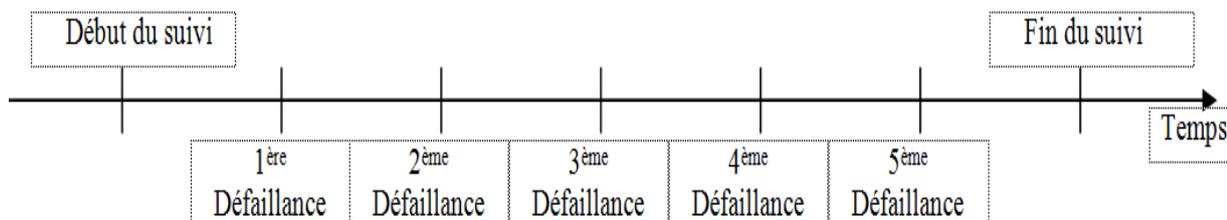
$$MTBF = E(t) = \int_0^{+\infty} t f(t) dt = \frac{1}{\lambda}$$

b. **aspect statistique** : La MTBF comme moyenne des temps de bon fonctionnement .

$$MTBF = \frac{\sum \text{des temps de bon fonctionnement entre les } n \text{ défaillances}}{\text{Nombre de périodes de bon fonctionnement}}$$

**Exemple:** Calcul de la MTBF, pour une pompe de traitement des eaux usées à partir de son fichier de suivi de défaillances.

Temps de suivi [h]	Temps total de maintenance [h]	Nombre de défaillances	TBF [h]
28 080	6.5	5	28 080-6.5 = 28 073.5



Le nombre de période de bon fonctionnement est égal au nombre de défaillances plus 1. Donc:

$$MTBF = \frac{\sum \text{des temps de bon fonctionnement}}{\text{Nombre de périodes de bon fonctionnement}} = \frac{28\,073.5}{6} = 4\,678[h]$$

## ❖ Fiabilité d'un système

### ➤ Système avec composants montés en série

Pour un système constitué de  $n$  composants montés en série, on montre que l'on a:

$$R(t) = R_1(t) \times R_2(t) \times R_3(t) \times \dots \times R_n(t)$$

- Le bon fonctionnement de chacun étant indépendant du bon fonctionnement des autres, où  $R_1, R_2, R_3, \dots, R_n$  sont les fonctions de fiabilités respectives des  $n$  composants.
- Le système est *défaillant* dès qu'un seul composant est défaillant.

**Exemple :** Soit un poste de radio constitué de quatre composants connectés en série, une alimentation  $R_1=0.95$ , une partie récepteur  $R_2=0.92$  ; un amplificateur  $R_3=0.97$  et haut-parleur  $R_4=0.89$  ; déterminer la fiabilité  $R_s$  de l'appareil.

$$R_s = R_1 * R_2 * R_3 * R_4 = 0.95 * 0.92 * 0.97 * 0.89 = 0.7545 \text{ (soit une fiabilité de 75\% environ)}$$

$$F_s = 1 - R_s = 1 - 0.7545 = 0.2455$$

### ➤ Système avec composants montés en parallèle

Pour un système constitués de  $n$  composants montés en parallèles on montre que l'on a:

$$F(t) = F_1(t) \times F_2(t) \times F_3(t) \times \dots \times F_n(t)$$

- le bon fonctionnement de chacun étant indépendant du bon fonctionnement des autres, où  $F_1, F_2, F_3, \dots, F_n$  sont les fonctions de défaillance respectives des  $n$  composants.
- Le système est *fonctionnel* dès qu'un seul composant est fonctionnel.

**Exemple :** Trois dispositifs A, B et C de même fiabilité  $R_1= R_2= R_3=0.75$  sont connectés en parallèle

$$F_s = (1-R_1)*(1- R_2)*(1- R_3) = 0.0156$$

$$R_s = 1 - F_s = 1 - 0.0156 = 0.9844$$